

**DIN EN IEC 61326-2-1
(VDE 0843-20-2-1)**
DIN

Diese Norm ist zugleich eine **VDE-Bestimmung** im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.

VDE

ICS 33.100.01

Einsprüche bis 2019-06-19

Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN 61326-2-1
(VDE 0843-20-2-1):2013-08

Entwurf

**Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen –
Teil 2-1: Besondere Anforderungen –
Prüfanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale für empfindliche
Prüf- und Messgeräte für Anwendungen ohne EMV-Schutzmaßnahmen
(IEC 65A/904/CD:2018);
Text Deutsch und Englisch**

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements –

Part 2-1: Particular requirements –

Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected applications

(IEC 65A/904/CD:2018);

Text in German and English

Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM –

Partie 2-1: Exigences particulières –

Configurations d'essai, conditions fonctionnelles et critères de performance pour essai de sensibilité et équipement de mesure pour les applications non protégées de la CEM

(IEC 65A/904/CD:2018);

Texte en allemand et anglais

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-04-19 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben;
- oder als Datei per E-Mail an dke@vde.com möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
- oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

Gesamtumfang 15 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist

Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 65A/904/CD:2018 „Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 2-1: Particular requirements – Test configurations, operational conditions and performance criteria for sensitive test and measurement equipment for EMC unprotected applications“ (CD, en: Committee Draft) ist unverändert in diesen Norm-Entwurf übernommen worden. Dieser Norm-Entwurf enthält eine noch nicht autorisierte deutsche Übersetzung.

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend der diesbezüglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigelegt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom SC 65A „System aspects“ der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf für eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf für eine Europäische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europäische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverändert als Deutsche Normen zu übernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum für einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf FprEN nur 6 Wochen beträgt, und dann keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden können, sondern nur noch eine „JA/NEIN“-Entscheidung möglich ist, wobei eine „NEIN“-Entscheidung fundiert begründet werden muss, wird bereits der CD als DIN-Norm-Entwurf veröffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit frühzeitig berücksichtigen zu können.

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 921.3 „Elektromagnetische Verträglichkeit in der Leittechnik“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. IEC ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieser Teil der internationalen Normenreihe IEC 61326 muss im Zusammenhang mit **IEC 61326-1** angewendet werden und folgt derselben Nummerierung der Abschnitte, Unterabschnitte, Tabellen und Abbildungen.

Ist ein bestimmter Unterabschnitt von **IEC 61326-1** in diesem Teil nicht erwähnt, so gilt dieser Unterabschnitt, soweit dies anwendbar ist. Wenn in dieser Norm „Ergänzung“, „Änderung“ oder „Ersatz“ angegeben ist, so ist der betreffende Text in **IEC 61326-1** entsprechend anzupassen.

ANMERKUNG Das folgende Nummerierungssystem findet Anwendung:

- Unterabschnitte, Tabellen und Abbildungen, die mit 101 beginnend nummeriert sind, sind zusätzlich zu denen in IEC 61326-1;
- wenn Anmerkungen nicht in einem neuen Unterabschnitt sind oder Anmerkungen in IEC 61326-1 beinhalten, werden sie mit 101 beginnend nummeriert, einschließlich jener in einem ersetzten Abschnitt oder Unterabschnitt;
- zusätzliche Anhänge werden mit AA, BB etc. bezeichnet.

Eine Auflistung aller Teile der Internationalen Normenreihe IEC 61326 unter dem allgemeinen Titel „Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen –“ ist auf der IEC Website zu finden.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 61326-2-1 (VDE 0843-20-2-1):2013-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Überarbeitung und Anpassung in Bezug auf die neueste Ausgabe von IEC 61326-1.

Inhalt

Seite

1	Anwendungsbereich	5
2	Normative Verweisungen	5
3	Begriffe	5
4	Allgemeines	5
5	EMV-Prüfplan	5
5.1	Allgemeines	5
5.2	Konfiguration des Prüflings (EUT) für die Prüfung	5
5.3	Betriebsbedingungen des Prüflings während der Prüfung	6
5.4	Festlegung des Funktionsverhaltens	7
5.5	Prüfbeschreibung	7
6	Anforderungen an die Störfestigkeit	7
6.1	Prüfbedingungen	7
6.2	Prüfanforderungen an die Störfestigkeit	7
6.3	Zufallsaspekte	7
6.4	Bewertungskriterien	7
7	Anforderungen an die Störaussendung	7
8	Prüfergebnisse und Prüfbericht	7
9	Anleitungen für den Gebrauch	7
9.101	Zusätzliche Angaben	8

**Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – EMV-Anforderungen –
Teil 2-1: Besondere Anforderungen –
Prüfanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale für empfindliche
Prüf- und Messgeräte für Anwendungen ohne EMV-Schutzmaßnahmen**

1 Anwendungsbereich

Zusätzlich zum Anwendungsbereich der **IEC 61326-1** legt dieser Teil der IEC 61326 für Geräte mit Prüf- und Messstromkreisen (innerhalb des Geräts, außerhalb des Gerätes, oder beides), die nach Angaben des Herstellers aus Betriebs- oder Funktionsgründen des Gerätes elektromagnetisch nicht geschützt sind, weitere detaillierte Anforderungen an die Prüfanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale (Bewertungskriterien) fest.

Der Hersteller legt die Umgebung fest, in der der Gebrauch des Gerätes beabsichtigt ist, und wählt die entsprechenden Prüfschärfen, die in der **IEC 61326-1** festgelegt sind.

ANMERKUNG Beispiele für solche Geräte sind Oszilloskope, Logikanalysatoren, Spektrumanalysatoren, Netzwerkanalysatoren, analoge Geräte, digitale Vielfachmessgeräte (DMM) und Leiterplattenprüfsysteme.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

Es gilt **IEC 61326-1, Abschnitt 2**, ausgenommen wie folgt:

Ergänzung:

IEC 61326-1:2012, *Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 1: General requirements*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach **IEC 61326-1** und IEC 60050-161.

4 Allgemeines

Es gilt **IEC 61326-1, Abschnitt 4**.

5 EMV-Prüfplan

5.1 Allgemeines

Es gilt **IEC 61326-1, Unterabschnitt 5.1**.

5.2 Konfiguration des Prüflings (EUT) für die Prüfung

Es gilt **IEC 61326-1, Unterabschnitt 5.2**, ausgenommen wie folgt:

Ergänzung: